

纳米颗粒 无处遁形

1分钟内实现对纳米颗粒浓度、成分、尺寸和粒度分布、溶解及团聚现象的检测

纳米科技正日益普遍地应用于化妆品、工业、生物技术和医疗用品当中，因此，快速准确地对纳米颗粒进行表征变得越来越重要。

采用传统方法表征纳米颗粒通常要花费数小时的时间进行操作和手动计算，现在，NexION® 2000 ICP-MS独特的单颗粒分析技术可以解决纳米颗粒检测和纳米材料研究中遇到的多种问题。其专业性、分辨率和灵敏度确保快速获得可靠数据。超快的瞬时数据采集速率和操作软件的纳米分析模块结合，让您在一次实验中完成全面的纳米表征。

NexION 2000 ICP-MS拥有如下独特技术：

- 超快的瞬时数据采集速率 (100000个数据点/秒) 与操作软件特别搭载的纳米分析模块完美结合
- 单次实验可获得颗粒浓度、成分、尺寸和粒度分布，溶解与团聚现象等信息
- 专利的实时信号处理技术，瞬时分辨离子与颗粒信号
- 60秒内完成全面的纳米颗粒表征

仅需一分钟，即可从纳米颗粒研究中获得更多信息！

获取更多信息，请访问www.perkinelmer.com/NexION2000



NexION 2000 ICP-MS



Syngistix™ Nano 纳米颗粒分析软件

珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司
地址：上海 张江高科技园区 张衡路1670号
邮编：201203
电话：021-60645888
传真：021-60645999
www.perkinelmer.com.cn


PerkinElmer
For the Better

要获取全球办事处的完整列表，请访问<http://www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs>

版权所有 ©2017, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer® 是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自所有者或所有者的财产。